TD-LTE无线终端综合测试仪器的研究与开发

项目类型： 科学仪器基础研究专款项目　**项目批准号：** 61027003　**起止年限：** 2011-2013

SP8010软件著作权

sp8010终端综合测试仪

仪器简介　SP8010B 终端综合测试仪：
该仪表支持TD-LTE，FDD-LTE终端射频测试及非信令校准功能。其具有GPIB远程控制功能，同时具有丰富的外部接口，适合与其他仪表互连实现系统集成测试。可广泛应用于TD-LTE，FDD-LTE终端认证、研发、设计、制造和维修等领域中。

技术指标

1、CW输出频率范围：400 MHz ～ 2800 MHz；
2、频率分辨率：1 Hz；
3、CW输出功率范围：400M~2100M -120 dBm ～ -5 dBm（RF IN / OUT端口）；2100M~2800M-120dBm～-10dBm（RF IN/OUT端口）；400M~2100M -120 dBm ～ 0 dBm（RF OUT端口）；2100M~2800M -120dBm ～ -5dBm（RF OUT端口）；
4、输出功率分辨率：0.01 dB；
5、CW输出功率误差：700M~2800M≥-90dBm时±0.5dB（典型值0.3dB）；-90 dBm ～-120 dBm时 ±0.5dB（典型值0.3dB）；400M~700M≥-90 dBm时 ±0.5dB（典型值0.3dB）；-90 dBm ～-120 dBm时 ±0.8dB（典型值0.5dB）；
6、接收机射频指标：CW最大安全输入电平：+35dBm；CW输入频率范围：400 MHz ～ 2800 MHz；频率分辨率：1 Hz；CW输入功率范围：-65 dBm ～+35dBm；输入功率分辨率：0.01dB；CW输入功率测试误差优于±0.5dB（典型值0.3dB）；CW频率偏移测试范围±15 kHz；
7、时钟参考输入：输入频率要求：10 M±5Hz；输入电压要求：2V~4V Vpp sine/TTL。

应用领域

应用于TD-LTE，FDD-LTE终端认证、研发、设计、制造和维修等领域中。

产业化计划及需求

已完成产业化。

应用案例

SP8010B终端综合测试仪，转化为产品后被华为、中兴、展讯、高通、三星、苹果等国内外超过多家芯片、终端企业采购用于其研发和制造，并被中国信息通信研究院、中国无线电监测中心、中国移动等遴选为4G终端入网入库认证测试的标准仪器。

联系信息　**联系人：** 张雪菲　**移动电话：** 13520290540　**E-mail：** zhangxuefei@bupt.edu.cn
通讯地址： 北京市海淀区西土城路10号北京邮电大学